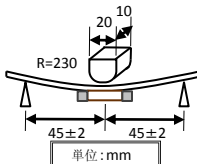


性能及测试方法

性能及测试方法（叠层型电容器）

项目		性能	测试方法及条件 (根据JIS C 5101-1)									
		R特性										
静电容量		允许差以内	CLASS 2									
Q值及介电损耗因数		RS:5.0%以下	<table><tr><td>标称静电容量</td><td>测定频率</td><td>测定电压</td></tr><tr><td>C≤10μF</td><td>1kHz±10%</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td>C>10μF</td><td>120Hz±10%</td><td>0.5±0.2Vrms</td></tr></table> 测定前进行热处理。	标称静电容量	测定频率	测定电压	C≤10μF	1kHz±10%	1.0±0.2Vrms	C>10μF	120Hz±10%	0.5±0.2Vrms
标称静电容量	测定频率	测定电压										
C≤10μF	1kHz±10%	1.0±0.2Vrms										
C>10μF	120Hz±10%	0.5±0.2Vrms										
耐电压		无绝缘破坏及破损 额定电压 50~100V : 额定电压的250% 额定电压 250 : 额定电压的200% 额定电压 630V : 额定电压的150%	施加电压 : 1~5秒 在硅油中施加压 (W.V. 630V以上) 充放电电流 : 50mA以下									
绝缘阻抗		10,000Ω 或 500Ω・μF任意小的一方值以上	施加电压 : 额定电压 (W.V. 630V以上 500V) 施加时间 : 1分钟									
粘附强度		端子电及无剥离或剥离迹象	荷重 : 5N 保持时间 : 10秒									
焊接粘附强度		端子电极面75%以上覆盖新焊接	温度: 230±5℃ 浸渍时间: 2±1秒									
温度循环	外观	无明显机械损伤	常 温 →最低使用温度→常 温 →最高使用温度 3分钟 → 30分钟 →3分钟 → 30分钟 依次将电容置于上述1~4个阶段中为一个循环 此操作进行五个循环									
	静电容量变化率	±7.5%以下										
	Q值及介电损耗因数	满足初始值										
	绝缘阻抗	满足初始值										
	耐电压	无绝缘破坏及破损										
耐湿负荷	外观	无明显机械损伤	进行电压处理 测试温度: 40±2℃ 相对湿度: 90~95%RH 测试电压: 额定电压 测试时间: 500小时									
	静电容量变化率	±12.5%以下										
	Q值及介电损耗因数	初始值的2倍以下										
	绝缘阻抗	1,000Ω 或 50Ω・μF任意小的一方值以上										
高温负荷	外观	无明显机械损伤	进行电压处理。 試験温度: 最高使用温度±3℃ 测试电压: W.V.=250V以下 : 额定电压定×200%的直流电压 W.V.=630V以上 : 额定电压×100%的直流电压 测试时间: 1000小时 *测试条件, 根据品种不同。详细请确认个别工艺书。									
	静电容量变化率	±12.5%以下										
	Q值及介电损耗因数	初始值的2倍以下										
	绝缘阻抗	1,000Ω 或 50Ω・μF任意小的一方值以上										
弯曲度	外观	无明显机械损伤	进行热处理。 弯曲量: 1mm 移动速度: 0.5mm/sec 测试中连接静电容量计 									
	静电容量变化率	±12.5%以下										

注1: 根据品种的不同, 性能各有差异, 详细信息请参照个别的规格书进行确认。
注2: 在150+0/-10℃环境中热处理1小时后, 取出放置室温中48±4小时。
注3: 电压处理: 在测试要求的条件下处理1小时后, 取出放置室温中48±4小时。